

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2013-98514

(P2013-98514A)

(43) 公開日 平成25年5月20日(2013.5.20)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
<b>H O 1 L 21/768 (2006.01)</b>	H O 1 L 21/90 N	2 G 0 6 5
<b>H O 1 L 23/532 (2006.01)</b>	H O 1 L 21/60 3 1 1 Q	5 F 0 3 3
<b>H O 1 L 21/60 (2006.01)</b>	H O 1 L 25/08 Z	5 F 0 4 4
<b>H O 1 L 25/065 (2006.01)</b>	H O 1 L 23/02 B	
<b>H O 1 L 25/07 (2006.01)</b>	H O 1 L 23/10 B	
審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 14 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号 特願2011-243132 (P2011-243132)  
 (22) 出願日 平成23年11月7日 (2011.11.7)

(71) 出願人 000002369  
 セイコーエプソン株式会社  
 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号  
 (74) 代理人 100095728  
 弁理士 上柳 雅誉  
 (74) 代理人 100107261  
 弁理士 須澤 修  
 (74) 代理人 100127661  
 弁理士 宮坂 一彦  
 (72) 発明者 今井 英生  
 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内  
 Fターム(参考) 2G065 AB02 BA13

最終頁に続く

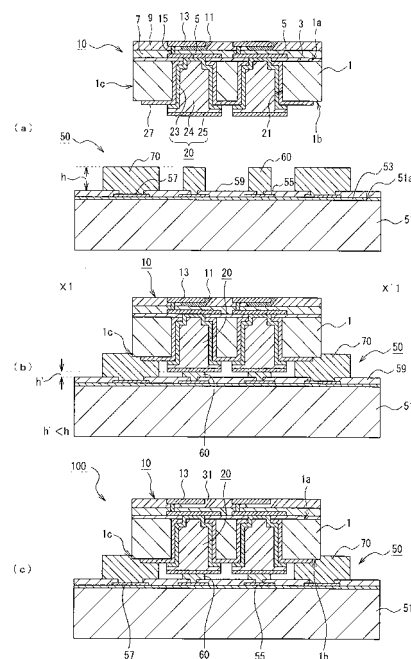
(54) 【発明の名称】 半導体装置の製造方法及び半導体装置、電子機器

## (57) 【要約】

【課題】空洞部の破壊を防ぐと共に、基板間の接続の信頼性を向上できるようにした半導体装置の製造方法及び半導体装置、電子機器を提供する。

【解決手段】第1の基板は、第1の面と第2の面とを有する第1の基材と、第1の基材の第1の面側に設けられた犠牲層と、第1の基材の第1の面と第2の面との間を貫通する貫通電極と、貫通電極と第1の基材との間に設けられた絶縁膜と、を有する。第2の基板は、第3の面を有する第2の基材と、第2の基材の第3の面側に設けられたパンプと、第2の基材の第3の面側に設けられ、パンプを囲む環状導電部と、を有する。第2の面と第3の面とを対向させた状態で、貫通電極とパンプとを接続すると共に、第1の基板の周縁部を環状導電部に埋入させる実装工程と、実装工程の後で、犠牲層をエッチングして第1の基材の第1の面側に空洞部を形成するエッチング工程と、を含む。

【選択図】図1



**【特許請求の範囲】****【請求項 1】**

少なくとも一方が半導体素子を含む第 1 の基板及び第 2 の基板を互いに接続して半導体装置を製造する方法であって、

前記第 1 の基板は、

第 1 の面及び該第 1 の面の反対側の第 2 の面を有する第 1 の基材と、

前記第 1 の基材の第 1 の面側に設けられた犠牲層と、

前記第 1 の基材の前記第 1 の面と前記第 2 の面との間を貫通する貫通電極と、

前記貫通電極と前記第 1 の基材との間に設けられた絶縁膜と、を有し、

前記第 2 の基板は、

第 3 の面を有する第 2 の基材と、

前記第 2 の基材の前記第 3 の面側に設けられたパンプと、

前記第 2 の基材の前記第 3 の面側に設けられ、前記パンプを囲む環状導電部と、を有し

10

、  
前記第 2 の面と前記第 3 の面とを対向させた状態で、前記貫通電極と前記パンプとを接続すると共に、前記第 1 の基板の周縁部を前記環状導電部に埋入させる実装工程と、

前記実装工程の後で、前記犠牲層をエッチングして前記第 1 の基材の前記第 1 の面側に空洞部を形成するエッチング工程と、を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。

**【請求項 2】**

前記実装工程の前に、前記貫通電極の前記パンプと接続される側の面に凹部を形成する凹部形成工程、をさらに含み、

20

前記実装工程では、前記凹部の内側に前記パンプの先端部を入れた状態で前記貫通電極と前記パンプとを接続することを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置の製造方法。

**【請求項 3】**

少なくとも一方が半導体素子を含む第 1 の基板及び第 2 の基板が互いに接続された半導体装置であって、

前記第 1 の基板は、

第 1 の面及び該第 1 の面の反対側の第 2 の面を有し、前記第 1 の面側に空洞部が設けられた第 1 の基材と、

前記第 1 の基材の前記第 1 の面と前記第 2 の面との間を貫通する貫通電極と、

30

前記貫通電極と前記第 1 の基材との間に設けられた絶縁膜と、を有し、

前記第 2 の基板は、

前記第 2 の面と対向する第 3 の面を有する第 2 の基材と、

前記第 2 の基材の前記第 3 の面側に設けられ、前記貫通電極に接続されたパンプと、

前記第 2 の基材の前記第 3 の面側に設けられ、前記パンプを囲む環状導電部と、を有し

、  
前記第 1 の基板の周縁部が前記環状導電部に埋入していることを特徴とする半導体装置。

**【請求項 4】**

前記第 1 の基板は、

40

前記第 1 の基材の前記第 1 の面と前記第 2 の面との間であって、前記貫通電極よりも前記周縁部に近い位置を貫通する第 2 の貫通電極、をさらに有し、

前記第 2 の貫通電極と前記第 1 の基材との間に絶縁膜が設けられており、

前記第 2 の貫通電極と前記環状導電部とが接続されていることを特徴とする請求項 3 に記載の半導体装置。

**【請求項 5】**

前記第 1 の基板の前記第 2 の面と前記第 2 の基板の前記第 3 の面との間であって、前記環状導電部で囲まれる領域に設けられた樹脂、をさらに有することを特徴とする請求項 3 又は請求項 4 に記載の半導体装置。

**【請求項 6】**

50

請求項 3 から請求項 5 の何れか一項に記載の半導体装置を備えることを特徴とする電子機器。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、半導体装置の製造方法及び半導体装置、電子機器に関する。

【背景技術】

【0002】

従来技術として、例えば、特許文献 1 ～ 3 に開示されたものがある。即ち、特許文献 1 には、犠牲層を除去することにより形成された空洞部の上方で支持部により支えられた構造の焦電型検出素子が開示されている。また、特許文献 2 には、シリコンの第 1 の面（集積回路形成面）と第 2 の面（裏面）との間を貫く貫通電極が開示されている。そして、特許文献 3 には、電子回路素子を基板に実装する際に、電子回路素子が有する外周封止用電極を、基板が有する封止用電極に接合することによって、外周封止用電極の内側に配置されているチップ電極を封止する技術が開示されている。

10

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献 1】特開 2011 - 153851 号公報

20

【特許文献 2】特開 2010 - 177237 号公報

【特許文献 3】特開 2004 - 214469 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

ところで、特許文献 1 に開示されたような、空洞部の上方で支えられた構造の焦電型検出素子を他の基板に実装する場合、この焦電型素子に実装時の荷重が加えられると、その荷重によって空洞部が破壊されてしまう可能性がある。このような空洞部の破壊を防ぐ方法として、空洞部が形成される前に焦電型素子を基板に実装しておき、実装後に空洞部を形成する方法が考えられる。また、上記の実装に際しては、特許文献 3 に開示されているように、外周封止用電極と封止用電極とを接続することにより、それらの内側に位置するチップ電極を気密封止する方法が考えられる。

30

【0005】

ここで、上記の焦電型検出素子が、特許文献 2 に開示されたような貫通電極を有する場合は、特許文献 2 の図 3 に記載されている下地層 141（例えばシリコン酸化物（ $\text{SiO}_2$ ）やシリコン窒化物（ $\text{Si}_3\text{N}_4$ ）等の絶縁性材料からなる）は外周封止用電極の外側に露出した構造となる。このため、犠牲層をエッチングして空洞部を形成する際に、この下地層もエッチングされてしまう可能性があった。下地層がエッチングされると、外周封止用電極と半導体基板との間に隙間が生じてエッチャント等が侵入する。その結果、上記の気密封止が破られて、焦電型素子と基板との接続の信頼性が低下してしまう可能性があった。

40

そこで、この発明はこのような事情に鑑みてなされたものであって、空洞部の破壊を防ぐと共に、基板間の接続の信頼性を向上できるようにした半導体装置の製造方法及び半導体装置、電子機器を提供することを目的の一つとする。

【課題を解決するための手段】

【0006】

上記課題を解決するために、本発明の一態様に係る半導体装置の製造方法は、少なくとも一方が半導体素子を含む第 1 の基板及び第 2 の基板を互いに接続して半導体装置を製造する方法であって、前記第 1 の基板は、第 1 の面及び該第 1 の面の反対側の第 2 の面を有する第 1 の基材と、前記第 1 の基材の第 1 の面側に設けられた犠牲層と、前記第 1 の基材

50

の前記第 1 の面と前記第 2 の面との間を貫通する貫通電極と、前記貫通電極と前記第 1 の基板との間に設けられた絶縁膜と、を有し、前記第 2 の基板は、第 3 の面を有する第 2 の基板と、前記第 2 の基板の前記第 3 の面側に設けられたパンプと、前記第 2 の基板の前記第 3 の面側に設けられ、前記パンプを囲む環状導電部と、を有し、前記第 2 の面と前記第 3 の面とを対向させた状態で、前記貫通電極と前記パンプとを接続すると共に、前記第 1 の基板の周縁部を前記環状導電部に埋入させる実装工程と、前記実装工程の後で、前記犠牲層をエッチングして前記第 1 の基板の前記第 1 の面側に空洞部を形成するエッチング工程と、を含むことを特徴とする。

このような製造方法であれば、エッチング工程の前に実装工程を行う。実装工程では空洞部は未形成であり、第 1 の基板に付加される荷重で空洞部が壊れることはない。このため、上記の空洞部を壊すことなく、第 1 の基板を第 2 の基板に実装することができる。

【 0 0 0 7 】

また、この実装工程では、第 1 の基板の周縁部を環状導電部に埋入することにより、絶縁膜を環状導電部で囲まれた領域内に封止する。絶縁膜が環状導電部の外側に露出しないようにすることができるので、エッチング工程で絶縁膜がエッチングされることを防ぐことができ、第 1 の基板と第 2 の基板との間に隙間が生じることを防ぐことができる。従って、この隙間を通して半導体装置内に水分等が侵入することを防ぐことができ、貫通電極等の腐食を防ぐことができる。これにより、第 1 の基板と第 2 の基板との接続の信頼性を高めることができる。

【 0 0 0 8 】

なお、本発明の「第 1 の基板」としては、例えば、後述する半導体チップ 1 0、又は、半導体チップ 1 1 0 が該当する。「第 2 の基板」としては、例えば、後述するベース基板 5 0 が該当する。「第 1 の基材」としては例えば後述する基材 1 が該当し、「第 1 の面」としては例えば後述する表面 1 a が該当し、「第 2 の面」としては例えば後述する裏面 1 b が該当する。また、「第 2 の基材」としては例えば後述する基材 5 1 が該当し、「第 3 の面」としては例えば後述する表面 5 1 a が該当する。さらに、「絶縁膜」としては、例えば、後述する T S V 絶縁膜 2 7 が該当する。「環状導電部」としては、例えば、後述する環状パンプ 7 0 が該当する。

【 0 0 0 9 】

また、上記の半導体装置の製造方法において、前記実装工程の前に、前記貫通電極の前記パンプと接続される側の面に凹部を形成する凹部形成工程、をさらに含み、前記実装工程では、前記凹部の内側に前記パンプの先端部を入れた状態で前記貫通電極と前記パンプとを接続することを特徴としてもよい。このような製造方法であれば、実装工程でのパンプの潰れを抑制することができる。これにより、パンプが潰れて水平方向に広がり、隣り合うパンプ同士が意図せず接触する（即ち、ショートする）可能性を低減することができる。

【 0 0 1 0 】

本発明の別の態様に係る半導体装置は、少なくとも一方が半導体素子を含む第 1 の基板及び第 2 の基板が互いに接続された半導体装置であって、前記第 1 の基板は、第 1 の面及び該第 1 の面の反対側の第 2 の面を有し、前記第 1 の面側に空洞部が設けられた第 1 の基板と、前記第 1 の基板の前記第 1 の面と前記第 2 の面との間を貫通する貫通電極と、前記貫通電極と前記第 1 の基板との間に設けられた絶縁膜と、を有し、前記第 2 の基板は、前記第 2 の面と対向する第 3 の面を有する第 2 の基板と、前記第 2 の基板の前記第 3 の面側に設けられ、前記貫通電極に接続されたパンプと、前記第 2 の基板の前記第 3 の面側に設けられ、前記パンプを囲む環状導電部と、を有し、前記第 1 の基板の周縁部が前記環状導電部に埋入していることを特徴とする。このような構成であれば、上記の製造方法により半導体装置を製造することができる。従って、空洞部が破壊されておらず、且つ、第 1 の基板と第 2 の基板とが信頼性高く接続された半導体装置を提供することができる。

【 0 0 1 1 】

また、上記の半導体装置において、前記第 1 の基板は、前記第 1 の基板の前記第 1 の面

10

20

30

40

50

と前記第 2 の面との間であって、前記貫通電極よりも前記周縁部に近い位置を貫通する第 2 の貫通電極、をさらに有し、前記第 2 の貫通電極と前記第 1 の基材との間に絶縁膜が設けられており、前記第 2 の貫通電極と前記環状導電部とが接続されていることを特徴としてもよい。このような構成であれば、第 2 の基板の環状導電部を第 1 の基板と接続する端子として用いることができる。例えば、環状導電部が接地電位（グランド）に接続される場合は、この環状導電部を半導体素子と第 2 の基板とに共通のグランド端子として用いることができる。

#### 【 0 0 1 2 】

また、上記の半導体装置において、前記第 1 の基板の前記第 2 の面と前記第 2 の基板の前記第 3 の面との間であって、前記環状導電部で囲まれる領域に設けられた樹脂、をさらに有することを特徴としてもよい。このような構成であれば、第 1 の基板と第 2 の基板とに樹脂を密着させることができる。樹脂と第 1 の基板との間に働く接着力と、樹脂と第 2 の基板との間に働く接着力とにより、第 1 の基板と第 2 の基板との接続強度をさらに高めることができる。これにより、第 1 の基板と第 2 の基板との接続の信頼性をさらに高めることができる。なお、本発明の「樹脂」としては、例えば、後述する封止樹脂 8 1 が該当する。

本発明のさらに別の態様に係る電子機器は、上記の半導体装置を備えることを特徴とする。このような構成であれば、空洞部が破壊されておらず、且つ、第 1 の基板と第 2 の基板とが信頼性高く接続された半導体装置を備えた電子機器を提供することができる。

#### 【 図面の簡単な説明 】

#### 【 0 0 1 3 】

【 図 1 】 第 1 実施形態に係る半導体装置 1 0 0 の製造方法を示す図。

【 図 2 】 パンプ 6 0 及び環状パンプ 7 0 の形状等の一例を示す図。

【 図 3 】 半導体チップ 1 0 と環状パンプ 7 0 との位置関係の一例を示す図。

【 図 4 】 半導体装置 1 0 0 の第 1 変形例を示す図。

【 図 5 】 半導体装置 1 0 0 の第 2 変形例を示す図。

【 図 6 】 半導体装置 1 0 0 の第 3 変形例を示す図。

【 図 7 】 第 2 実施形態に係る半導体装置 2 0 0 の製造方法を示す図。

【 図 8 】 第 2 の貫通電極 2 0 b と環状パンプ 7 0 との位置関係の一例を示す図。

【 図 9 】 半導体装置 2 0 0 の第 1 変形例を示す図。

【 図 1 0 】 半導体装置 2 0 0 の第 2 変形例を示す図。

【 図 1 1 】 半導体装置 2 0 0 の第 3 変形例を示す図。

#### 【 発明を実施するための形態 】

#### 【 0 0 1 4 】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下に説明する各図において、同一の構成を有する部分には同一の符号を付し、その重複する説明は省略する。

#### （ 1 ） 第 1 実施形態

#### （ 1 . 1 ） 製造方法及び構成

図 1 （ a ）～（ c ）は、本発明の第 1 実施形態に係る半導体装置 1 0 0 の製造方法を示す断面図である。図 1 （ a ）に示すように、まず始めに、半導体チップ 1 0 と、ベース基板 5 0 とを用意する。

#### 【 0 0 1 5 】

半導体チップ 1 0 は、例えばシリコン等からなる基材 1 と、この基材 1 の表面 1 a の側に形成された第 1 の絶縁層 3 と、第 1 の絶縁層 3 上に形成された電極 5 と、電極 5 を覆うように形成された第 2 の絶縁層 7 と、第 2 の絶縁層 7 上に形成された第 3 の絶縁層 9 と、第 3 の絶縁層 9 に埋め込まれた犠牲層 1 1 と、この犠牲層 1 1 の一部を覆うように第 3 の絶縁層 9 上に設けられた素子 1 3 と、素子 1 3 と電極 5 とを接続するプラグ電極 1 5 と、を備える。第 1 の絶縁層 3、第 2 の絶縁層 7、第 3 の絶縁層 9 は、例えばシリコン酸化膜（ $\text{SiO}_2$ ）又はシリコン窒化膜（ $\text{Si}_3\text{N}_4$ ）からなる。電極 5 は、例えば、窒化チタ

ン ( T i N ) からなる。犠牲層 1 1 は、例えばシリコン酸化膜からなる。素子 1 3 は、例えば赤外線を検出可能な焦電センサーである。プラグ電極 1 5 は、例えばタングステン ( W ) からなる。

#### 【 0 0 1 6 】

なお、図示しないが、第 3 の絶縁層 9 の表面と、第 2 の絶縁層 7 と犠牲層 1 1 との間、及び、第 3 の絶縁層 9 と犠牲層 1 1 との間には、エッチング防止膜が設けられていてもよい。また、第 1 の絶縁層 3 と、第 2 の絶縁層 7 及び、第 3 の絶縁層 9 の側面にもエッチング防止膜が設けられていてもよい。このエッチング防止膜は、後述の空洞部を形成するために犠牲層 1 1 をエッチングする工程において、第 2 の絶縁層 7 と第 3 の絶縁層 9 がエッチングされることを防止するための膜である。エッチング防止膜としては、例えば、シリ

10

#### 【 0 0 1 7 】

また、この半導体チップ 1 0 は、貫通電極 ( T S V : T h r o u g h S i V i a ) 2 0 と、この貫通電極 2 0 と基材 1 との間に設けられた T S V 絶縁膜 2 7 と、を備える。図 1 ( a ) に示すように、基材 1 には、その表面 1 a と裏面 1 b との間を貫通する貫通孔 2 1 が設けられている。貫通電極 2 0 は、この貫通孔 2 1 内に T S V 絶縁膜 2 7 を介して設けられている。即ち、T S V 絶縁膜 2 7 は、貫通孔 2 1 の内側面から基材 1 の裏面 1 b にかけて設けられている。T S V 絶縁膜 2 7 は、例えばシリコン酸化膜である。

20

#### 【 0 0 1 8 】

貫通電極 2 0 は、例えば、スパッタリングで形成されたシード層 2 3 と、電解めっき法で形成された電極本体 2 4 と、電極本体 2 4 のベース基板 5 0 と接続される側の面 ( 例えば、下面 ) に設けられたろう材 2 5 と、を有する。シード層 2 3 及び電極本体 2 4 は例えば銅 ( C u ) であり、ろう材 2 5 は例えばスズと銀との合金 ( S n - A g ) である。このような構成の貫通電極 2 0 は、第 1 の絶縁層 3 を貫いて電極 5 に接続されている。

#### 【 0 0 1 9 】

一方、ベース基板 5 0 は、例えばシリコン等からなる基材 5 1 と、この基材 5 1 の表面 5 1 a の側に形成された絶縁層 5 3 と、この絶縁層 5 3 上に形成された第 1 の電極 5 5 及び第 2 の電極 5 7 と、これら第 1 の電極 5 5 及び第 2 の電極 5 7 を覆うように絶縁層 5 3 上に形成されたパシベーション膜 5 9 と、このパシベーション膜 5 9 上に形成されたパンプ 6 0 及び環状パンプ 7 0 と、を備える。図 1 ( a ) に示すように、パシベーション膜 5 9 には、第 1 の電極 5 5 又は第 2 の電極 5 7 を底面とする開口部が設けられている。この開口部を介して、パンプ 6 0 は電極 5 5 に接続され、環状パンプ 7 0 は電極 5 7 に接続されている。

30

#### 【 0 0 2 0 】

図 2 は、パンプ 6 0 及び環状パンプ 7 0 の各形状と、これらの位置関係の一例を示す平面図である。図 2 に示すように、パンプ 6 0 の平面視による形状 ( 以下、平面形状 ) は例えば円形である。また、環状パンプ 7 0 の平面形状は例えば矩形枠である。環状パンプ 7 0 はパンプ 6 0 を平面視で囲むように配置されている ( 即ち、パンプ 6 0 は環状パンプ 7 0 で囲まれた領域に配置されている。 ) 。

40

#### 【 0 0 2 1 】

図 1 ( a ) に戻って、絶縁層 5 3 は、例えばシリコン酸化膜からなる。第 1 の電極 5 5 と第 2 の電極 5 7 は、例えばアルミニウム ( A l ) からなる。パンプ 6 0 及び環状パンプ 7 0 は、例えば金 ( A u ) からなる。パシベーション膜 5 9 は、例えばポリイミドからなる。また、図 1 ( a ) において、パンプ 6 0 及び環状パンプ 7 0 のパシベーション膜 5 9 からの高さを h としたとき、h は例えば 1 0 ~ 2 5  $\mu$  m である。なお、図示しないが、第 1 の電極 5 5 とパンプ 6 0 との間、及び第 2 の電極 5 7 と環状パンプ 7 0 との間には、それぞれ、チタン ( T i )、タングステン ( W )、プラチナ ( P t )、銅 ( C u ) 又はクロム ( C r ) 等の中間層が設けられていてもよい。

50

## 【0022】

次に、用意した半導体チップ10とベース基板50とを重ね合わせて接合する。即ち、半導体チップ10をベース基板50に実装する（実装工程）。ここでは、図1（a）の矢印で示すように、半導体チップ10の裏面1bの側とベース基板50の表面51aの側とを対向させる。そして、この状態で半導体チップ10をベース基板50に相対的に押圧して、半導体チップ10をベース基板50に接合する。

## 【0023】

これにより、図1（b）に示すように、貫通電極20とパンプ60とを接続すると共に、半導体チップ10の周縁部（側面を含む）1cを環状パンプ70に埋入させる。なお、この実装工程では、パンプ60は貫通電極20と接合することにより押し潰される。押し潰された後のパンプ60のパシベーション膜59からの高さを $h'$ としたとき、 $h > h'$ である。 $h'$ は例えば5～15 $\mu\text{m}$ である。

図3は、半導体チップ10をベース基板50に実装した後の、半導体チップ10と環状パンプ70との位置関係の一例を示す平面図である。図3に示すように、犠牲層11のエッチング工程では、半導体チップ10の周縁部1cは全周に亘って環状パンプ70に埋設されている。

## 【0024】

次に、実装工程の後で、犠牲層11をエッチングして除去する（エッチング工程）。このエッチング工程では、図1（b）及び図3に示したように、犠牲層11の一部が素子13の下から露出している。このため、半導体チップ10をベース基板50と共に、HF溶液に浸漬する（又は、HFベーパー雰囲気中に晒す）ことによって、シリコン酸化膜からなる犠牲層11をエッチングして除去することができる。これにより、図1（c）に示すように、半導体チップ10に空洞部31が形成される。以上の工程を経て、半導体チップ10とベース基板50とが接続され、空洞部31の上方に素子13を有する構造の半導体装置100が完成する。

## 【0025】

完成後の半導体装置100は、下記の構成を有する。即ち、図1（c）に示すように、半導体装置100は、半導体チップ10とベース基板50とを備える。半導体チップ10は、表面1a側に空洞部31が設けられた基材1と、この基材1の表面1aと裏面1bとの間を貫通する貫通電極20と、貫通電極20と基材1との間に設けられたTSV絶縁膜27と、を有する。ベース基板50は、基材51と、この基材51の表面51a側に設けられたパンプ60と、表面51側に設けられ、パンプ60を囲む環状パンプ70と、を有する。そして、半導体チップ10の裏面1bとベース基板50の表面51aとが対向した状態で、貫通電極20とパンプ60とが接続されると共に、半導体チップ10の周縁部1cが環状パンプ70に埋入している。ここで、「半導体チップ10の周縁部1cが環状パンプ70に埋入している」とは、半導体チップ10の表面1a及び裏面1bを接続する側面と裏面1bとで形成される角部とが、環状パンプ70に覆われている状態のことである。

## 【0026】

なお、図示しないが、ベース基板50には、第1の電極55又は第2の電極57等の配線の他に、例えば、半導体チップ10を制御する制御回路等が形成されていてもよい。この図示しない制御回路は、実装工程の前に、CMOSプロセスでベース基板50に形成することが可能である。このように、制御回路がベース基板50に形成されている場合は、例えば、この制御回路と素子13との間で貫通電極20（第2実施形態では、第1の貫通電極20a）を経由して、信号の送受が行われる。

## 【0027】

（1.2）第1実施形態の効果

本発明の第1実施形態によれば、エッチング工程の前に実装工程を行う。実装工程では空洞部31は未形成であり、半導体チップ10に付加される荷重で空洞部31が壊れることはない。このため、素子13の下方に形成される空洞部31を壊すことなく、半導体チ

10

20

30

40

50

チップ 10 をベース基板 50 に実装することができる。

#### 【0028】

また、この実装工程では、半導体チップ 10 の周縁部 1c を環状バンパ 70 に埋入させる。これにより、TSV 絶縁膜 27 を環状バンパ 70 で囲まれた領域内に封止する。TSV 絶縁膜 27 が環状バンパ 70 の外側に露出しないようにすることができるので、エッチング工程で TSV 絶縁膜 27 がエッチングされることを防ぐことができ、半導体チップ 10 とベース基板 50 との間に隙間が生じることを防ぐことができる。この隙間を通して半導体装置内に水分等が侵入することを防ぐことができるため、貫通電極 20 等の腐食を防ぐことができる。従って、半導体チップ 10 とベース基板 50 との接続の信頼性を高めることができる。次に、第 1 実施形態の変形例を示す。

10

#### 【0029】

##### (1.3) 第 1 変形例

図 4 は、半導体装置 100 の第 1 変形例を示す断面図である。図 4 に示すように、半導体装置 100 は、半導体チップ 10 とベース基板 50 との間であって、環状バンパ 70 で囲まれた領域内に封止樹脂 81 を有していてもよい。封止樹脂 81 としては、例えば、熱硬化性のエポキシ系樹脂、ポリイミド系樹脂、アクリル系樹脂などが挙げられる。このような構成であれば、半導体チップ 10 とベース基板 50 とに封止樹脂 81 を密着させることができる。封止樹脂 81 と半導体チップ 10 との間に働く接着力と、封止樹脂 81 とベース基板 50 との間に働く接着力とにより、半導体チップ 10 とベース基板 50 との接続強度をさらに高めることができる。これにより、半導体チップ 10 とベース基板 50 との接続の信頼性をさらに高めることができる。

20

#### 【0030】

なお、上記の封止樹脂 81 は、例えば実装工程の前に、ベース基板 50 の環状バンパ 70 で囲まれた領域に塗布する。そして、封止樹脂 81 を塗布した後で半導体チップ 10 をベース基板 50 に実装する。これにより、半導体チップ 10 とベース基板 50 との間であって、環状バンパ 70 で囲まれた領域に封止樹脂 81 を封入することができる。この封止樹脂 81 が熱硬化性の場合は、例えば、実装時の熱で封止樹脂 81 を硬化させることができる。

#### 【0031】

##### (1.4) 第 2 の変形例

図 5 は、半導体装置 100 の第 2 変形例を示す断面図である。図 5 に示すように、半導体装置 100 は、環状バンパ 70 の半導体チップ 10 から露出している領域 71 上に、半導体チップ 10 の側面を覆う絶縁性の樹脂 83 を有していてもよい。この樹脂 83 は、例えば、図 1 (b) の段階で上記の領域 71 上に塗布しておく。即ち、半導体チップ 10 の周縁部 1c を環状バンパ 70 に埋設した後で樹脂 83 を塗布しておく。そして、樹脂 83 を塗布した後で、犠牲層 11 をエッチングする。樹脂 83 としては、例えば、熱硬化性又は紫外線硬化性のエポキシ系樹脂、ポリイミド系樹脂、アクリル系樹脂などが挙げられる。

30

#### 【0032】

このような構成であれば、犠牲層 11 をエッチングする際に、半導体チップ 10 と環状バンパ 70 との接触界面にエッチャントが直接接触することを防ぐことができる。エッチャントが接触界面に沿って TSV 絶縁膜 27 まで到達する可能性をさらに低減することができるので、半導体チップ 10 とベース基板 50 との接続の信頼性をさらに高めることができる。

40

#### 【0033】

##### (1.5) 第 3 の変形例

図 6 は、半導体装置 100 の第 3 の変形例を示す断面図である。図 6 に示すように、半導体装置 100 の製造工程では、貫通電極 20 のバンパ 60 と接続される側の面に凹部 29 を形成してもよい (凹部形成工程)。この凹部 29 は、貫通電極 20 を形成する際のめっき処理時間を、凹部 29 を有さない場合 (例えば、図 1 (a) の場合) よりも短めに調

50



整することで、形成することができる。また、ろう材 25 は、貫通電極 20 に凹部 29 を形成した後で、その凹部 29 の底面及び内側面を覆うように形成する。そして、実装工程では、パンプ 60 の先端部 61 を凹部 29 の内側まで入れて、貫通電極 20 とパンプ 60 とを接続する。このような製造方法であれば、パンプ 60 の潰れを抑制することができる。これにより、パンプ 60 が潰れて水平方向に広がり、隣り合うパンプ 60 同士が意図せず接触する（即ち、ショートする）可能性を低減することができる。

#### 【0034】

##### （２）第２実施形態

上記の第１実施形態では、半導体チップ 10 の周縁部 1c を環状パンプ 70 に埋め込んで、この環状パンプ 70 で囲まれた領域を封止する場合について説明した。つまり、環状パンプ 70 を封止材として用いる場合について説明した。しかしながら、本発明では、環状パンプ 70 に電極としての機能を追加してもよい。第２実施形態では、このような形態について説明する。

10

#### 【0035】

##### （２．１）製造方法及び構成

図 7（a）～（c）は、本発明の第２実施形態に係る半導体装置 200 の製造方法を示す断面図である。図 2（a）に示すように、まず始めに、半導体チップ 110 と、ベース基板 50 とを用意する。

半導体チップ 110 は、例えば、基材 1 と、第１の絶縁層 3 と、第１の絶縁層 3 上に形成された第１の電極 5a 及び第２の電極 5b と、第１の電極 5a 及び第２の電極 5b を覆うように形成された第２の絶縁層 7 と、第３の絶縁層 9 と、犠牲層 11 と、素子 13 と、を備える。第１の電極 5a 及び第２の電極 5b の材質は、例えば、第１実施形態で説明した電極 5 と同じである。

20

#### 【0036】

また、この半導体チップ 110 は、第１の貫通電極 20a と、第２の貫通電極 20b と、TSV 絶縁膜 27 と、プラグ電極 15 と、を備える。ここで、基材 1 の表面 1a と裏面 1b との間には、当該間を貫通する第１の貫通孔 21a と第２の貫通孔 21b とが設けられている。第２の貫通孔 21b は、第１の貫通孔 21a よりも周縁部 1c に近い位置に設けられている。第１の貫通電極 20a は TSV 絶縁膜 27 を介して第１の貫通孔 21a 内に設けられており、第２の貫通電極 20b は TSV 絶縁膜 27 を介して第２の貫通孔 21b 内に設けられている。第１の貫通電極 20a と第２の貫通電極 20b の各構造及び各材質は、第１実施形態で説明した貫通電極 20 と同じである。

30

なお、第２の貫通電極 20b に接続する第２の電極 5b は、素子 13 に接続するための電極ではなく、例えば、グランド電極（即ち、接地電位の電極）として用いられる。

#### 【0037】

次に、用意した半導体チップ 110 をベース基板 50 に実装する（実装工程）。ここでは、図 7（a）の矢印で示すように、半導体チップ 110 の裏面 1b の側とベース基板 50 の表面 51a の側とを対向させる。そして、この状態で半導体チップ 110 をベース基板 50 に相対的に押圧して、半導体チップ 110 をベース基板 50 に接合する。これにより、図 1（b）に示すように、貫通電極 20a とパンプ 60 とを接続すると共に、半導体チップ 110 の周縁部（側面を含む）1c を環状パンプ 70 に埋入させる。また同時に、貫通電極 20b を環状パンプ 70 に接続する。

40

#### 【0038】

図 8 は、半導体チップ 110 をベース基板 50 に実装した後の、第２の貫通電極 20b と環状パンプ 70 との位置関係の一例を示す平面図である。図 8 に示すように、第２の貫通電極 20b の少なくとも一部は環状パンプ 70 と平面視で重なるように配置されている。これにより、第２の貫通電極 20b と環状パンプ 70 とが接続される。このため、環状パンプ 70 を、例えば、半導体チップ 110 とベース基板 50 とに共通のグランド電極とすることができる。

#### 【0039】

50

次に、ベース基板 50 に実装された半導体チップ 110 の犠牲層 11 をエッチングして除去する（エッチング工程）。エッチングの方法は第 1 実施形態と同じである。これにより、図 7（c）に示すように、半導体チップ 110 の表面 1a 側に空洞部 31 が形成される。以上の工程を経て、半導体チップ 110 とベース基板 50 とが接続され、空洞部 31 の上方に素子 13 を有する構造の半導体装置 200 が完成する。

#### 【0040】

完成後の半導体装置 200 は、下記の構成を有する。即ち、図 7（c）に示すように、半導体装置 200 は、半導体チップ 110 とベース基板 50 とを備える。半導体チップ 110 は、基材 1 の表面 1a と裏面 1b との間を貫通する第 1 の貫通電極 20a と、第 1 の貫通電極 20a よりも周縁部 1c に近い位置を貫通する第 2 の貫通電極 20b と、を有する。また、TSV 絶縁膜 27 は、第 1 の貫通電極 20a と基材 1 との間、及び、第 2 の貫通電極 20b と基材 1 との間にそれぞれ設けられている。そして、第 1 の貫通電極 20a はパンプ 60 に接続され、第 2 の貫通電極 20b は環状パンプ 70 に接続されている。

10

#### 【0041】

##### （2.2）第 2 実施形態の効果

本発明の第 2 実施形態によれば、第 1 実施形態と同様の効果を奏する。

また、本発明の第 2 実施形態によれば、環状パンプ 70 を半導体チップ 110 と接続する端子として用いることができる。例えば、環状パンプ 70 が接地電位（グランド）に接続される場合は、この環状パンプ 70 を半導体チップ 110 とベース基板 50 とに共通のグランド端子として用いることができる。

20

#### 【0042】

##### （2.3）変形例

なお、この第 2 実施形態においても、第 1 実施形態で説明した第 1 ～ 第 3 の変形例と同様の態様を採ることができる。即ち、図 9 に示すように、半導体装置 200 は、半導体チップ 110 とベース基板 50 との間であって、環状パンプ 70 で囲まれた領域内に封止樹脂 81 を有していてもよい。これにより、半導体チップ 110 とベース基板 50 との接続の信頼性をさらに高めることができる。

#### 【0043】

また、図 10 に示すように、半導体装置 200 は、環状パンプ 70 の半導体チップ 110 から露出している領域 71 上から半導体チップ 110 の側面を覆う絶縁性の樹脂 83 を有していてもよい。これにより、犠牲層 11 をエッチングする際に、半導体チップ 110 と環状パンプ 70 との接触界面にエッチャントが直接接触することを防ぐことができる。エッチャントが接触界面に沿って TSV 絶縁膜 27 まで到達する可能性を低減することができるので、半導体チップ 110 とベース基板 50 との接続の信頼性をさらに高めることができる。

30

#### 【0044】

さらに、図 11 に示すように、半導体装置 200 を製造する過程では、第 1 の貫通電極 20a のパンプ 60 と接続される側の面、及び、第 2 の貫通電極 20b の環状パンプ 70 と接続される側の面にそれぞれ凹部 29 を形成してもよい（凹部形成工程）。これらの凹部 29 は、第 1 の貫通電極 20a 及び第 2 の貫通電極 20b を同時に形成する際のめっき処理時間を、凹部を有さない場合（例えば、図 7（a）の場合）よりも短めに調整することで、形成することができる。このような製造方法であれば、パンプ 60 の潰れを抑制することができる。これにより、パンプ 60 が潰れて水平方向に広がり、隣り合うパンプ 60 同士が意図せず接触する可能性を低減することができる。

40

#### 【0045】

##### （3）電子機器、その他

本発明の実施形態に係る電子機器は、上記の半導体装置 100（又は、半導体装置 200）を含んだものである。この電子機器が備える半導体装置は、素子の下方に位置する空洞部が破壊されておらず、且つ、半導体チップとベース基板とが信頼性高く接続されている。従って、信頼性の高い電子機器を提供することができる。

50

## 【 0 0 4 6 】

なお、上記の各実施形態に係る半導体装置の製造方法及び半導体装置、並びに、電子機器は、例えば、赤外線を受光することにより人体の存在を検出する人感センサーや、人体の温度分布などを検出する温度センサー等を一例とする各種機器と、その製造方法に適用することができる。また、本発明は、いわゆるMEMS (Micro Electro Mechanical Systems) プロセスを利用した半導体装置の製造方法と、この製造方法により形成される半導体装置にも適用することができる。

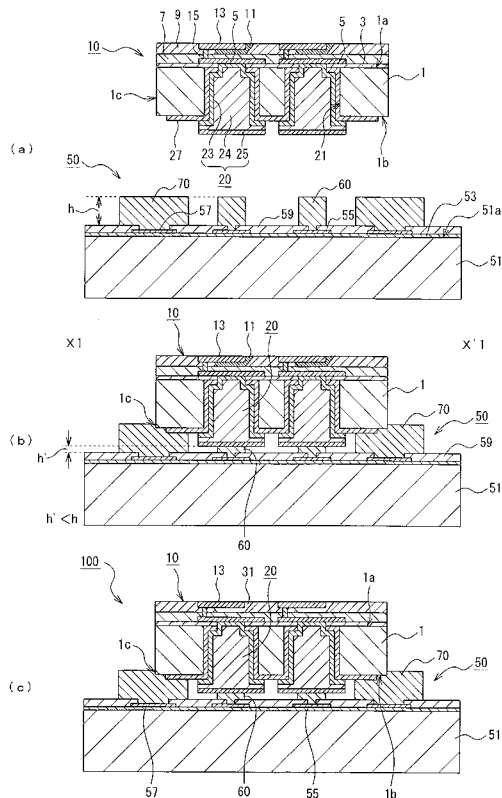
## 【 符号の説明 】

## 【 0 0 4 7 】

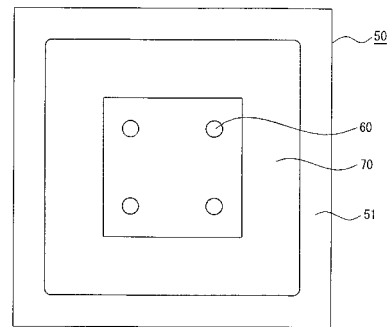
1 (半導体チップの) 基材、1 a、5 1 a 表面、1 b 裏面、1 c 周縁部 (側面を含む)、3 第1の絶縁層、5 電極、5 a 第1の電極、5 b 第2の電極、7 第2の絶縁層、9 第3の絶縁層、1 0、1 1 0 半導体チップ、1 1 犠牲層、1 3 素子、1 5 プラグ電極、2 0、2 0 a、2 0 b 貫通電極、2 1 貫通孔、2 3 シード層、2 4 電極本体、2 5 ろう材、2 7 TSV絶縁膜、2 9 凹部、3 1 空洞部、5 0 ベース基板、5 1 (ベース基板の) 基材、5 1 a 表面、5 3 絶縁層、5 5 第1の電極、5 7 第2の電極、5 9 パシベーション膜、6 0 バンプ、6 1 先端部、7 0 環状バンプ、7 1 (環状バンプの半導体チップ1 1から露出している) 領域、8 1 封止樹脂、8 3 樹脂、1 0 0、2 0 0 半導体装置

10

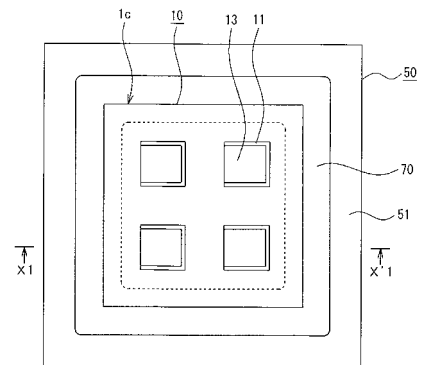
【 図 1 】



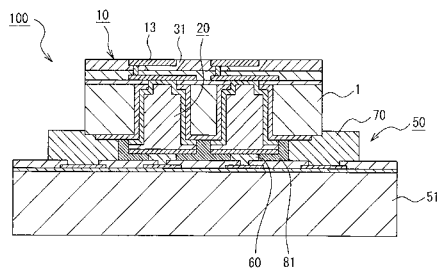
【 図 2 】



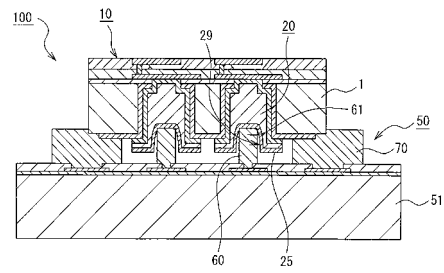
【 図 3 】



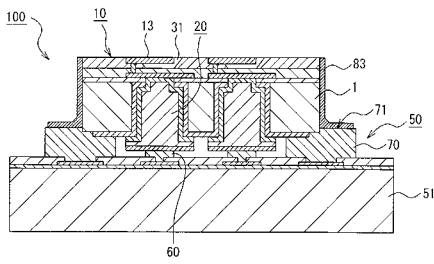
【図 4】



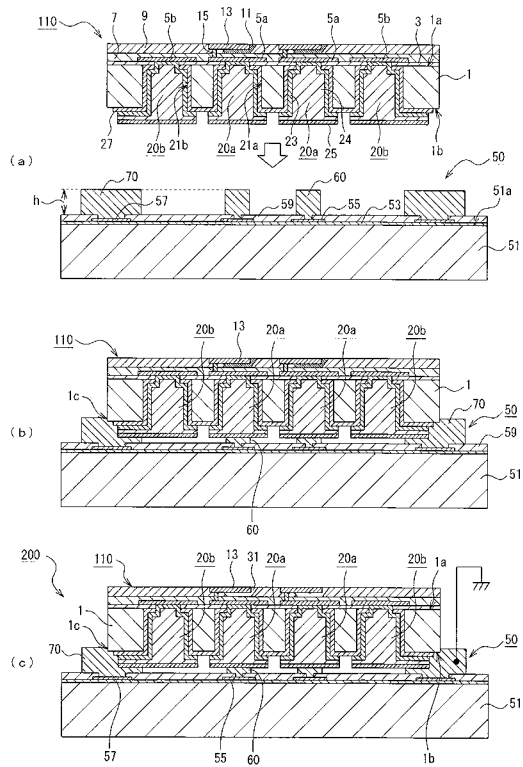
【図 6】



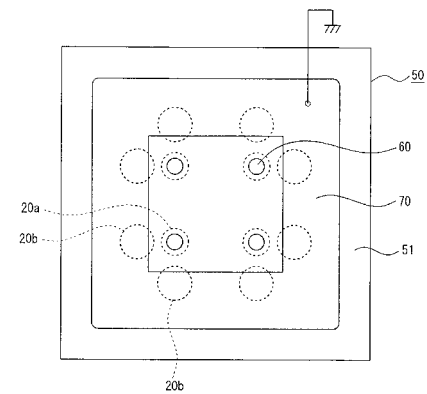
【図 5】



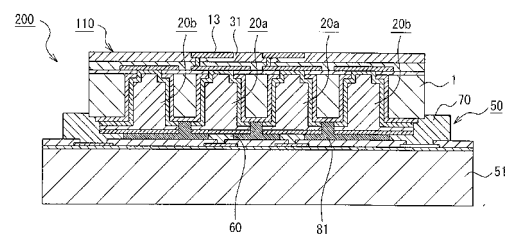
【図 7】



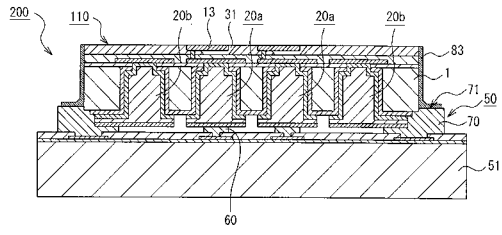
【図 8】



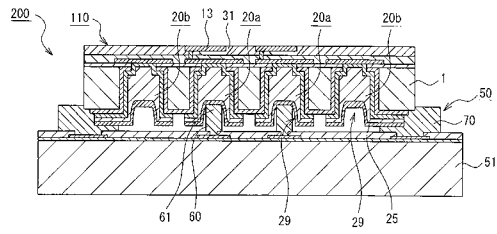
【図 9】



【図 10】



【図 11】



## フロントページの続き

(51)Int.Cl.	F I		テーマコード ( 参考 )
<i>H 0 1 L 25/18 (2006.01)</i>	H 0 1 L	23/12	F
<i>H 0 1 L 23/02 (2006.01)</i>	H 0 1 L	21/92	6 0 2 G
<i>H 0 1 L 23/10 (2006.01)</i>	H 0 1 L	21/92	6 0 2 R
<i>H 0 1 L 23/12 (2006.01)</i>	H 0 1 L	21/90	B
<i>H 0 1 L 23/522 (2006.01)</i>	H 0 1 L	21/88	J
<i>H 0 1 L 21/3205 (2006.01)</i>	H 0 1 L	21/88	T
<i>G 0 1 J 1/02 (2006.01)</i>	G 0 1 J	1/02	Y

F ターム( 参考 ) 5F033 HH07 HH11 HH13 HH14 HH17 HH18 HH19 JJ01 JJ11 JJ13  
 JJ14 JJ19 KK08 KK33 MM01 MM08 MM20 MM21 MM30 NN06  
 PP15 PP27 PP33 QQ07 QQ09 QQ19 QQ24 QQ25 QQ37 RR04  
 RR06 RR21 RR22 RR30 SS21 SS22 TT07 TT08 VV05 VV07  
 VV13 XX12 XX18 XX31  
 5F044 KK05 KK17 LL01 QQ02 QQ07 RR02 RR17 RR18 RR19